

平成20年9月9日

各 位

(社) 日本非破壊検査協会  
赤外線サーモグラフィによる  
非破壊評価特別研究委員会  
主 査 阪 上 隆 英  
[公印省略]

赤外線サーモグラフィによる非破壊評価セミオープン  
特別研究委員会開催について (案内)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は当協会の活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、赤外線サーモグラフィによる非破壊評価特別研究委員会では、下記の要領で特別研究委員会の開催を計画しています。

赤外線サーモグラフィ装置は、その性能が年々向上するとともに、低価格化による普及がますます進んでおり、非破壊試験の分野にも適用が拡大しております。赤外線サーモグラフィによる非破壊評価特別研究委員会では、赤外線サーモグラフィ装置の非破壊試験分野への更なる普及を目的として、下記の要領でセミオープン特別研究委員会の開催を計画しています。なお、本委員会はJSNDI会員の方にも参加頂けるセミオープン形式を予定しています。

準備と運営の都合上、9月22日(月)までにFax又はe-mail: nakamura@jsndi.or.jpでお知らせ下さいますようお願い申し上げます。

記

1. 主 催：社団法人 日本非破壊検査協会  
赤外線サーモグラフィによる非破壊評価特別研究委員会
2. 日 時：平成20年10月8日(水) 【委員会】 13:00～17:10  
【懇親会】 17:10～19:10
3. 会 場：東京都立産業技術研究センター 城南支所  
【特別研究委員会】 研修室
4. 参加費：赤外線サーモグラフィによる非破壊評価特別研究委員会委員及び登壇者 無料(資料1冊を含む)  
JSNDI正会員 無 料(資料1冊を含む)  
懇親会費 5,000円

※ 参加費及び懇親会費は、当日受付にてお支払い下さい。

問合せ：(社)日本非破壊検査協会 学術部 学術課 担当：中村  
TEL：03-5821-5105/ Fax：03-3863-6524  
e-mail: nakamura@jsndi.or.jp

5. プログラム：（※当日変更する場合もございます。）

- 13：00～13：10 開会挨拶 赤外線サーモグラフィ特研主査：大阪大学 阪上隆英
- 13：10～14：10 NECAvio 赤外線テクノロジー(株)の製品動向と計測事例紹介  
NEC Avio赤外線テクノロジー(株)  
太田二郎
- 14：10～15：10 フリアーシステムズジャパン(株)の世界動向と製品紹介  
フリアーシステムズジャパン (株) 荻野博之、植村英幸
- 15：10～15：30 休 憩
- 15：30～16：00 赤外線サーモグラフィにおける画像収録条件の検討  
小田急建設 (株) 和田光弘
- 16：00～16：30 光励起および超音波による非破壊検査の測定事例  
(株)ケン・オートメーション 矢尾板達也
- 16：30～17：00 赤外線計測機器デモ
- 17：00～17：10 閉会挨拶 赤外線サーモグラフィ特研主査：大阪大学 阪上隆英
- 17：10～19：10 懇親会